

Phemet[®]

高精度晶圆几何形貌测量系统



Phemet®

自动化几何形貌量测工具

Wooptix开发了一套晶圆量测系统Phemet，该系统采用了WFPI技术——波前相位成像传感技术。



Phemet使用全新的半导体晶圆测量技术，仅需单次测量，即可获取正片硅晶圆的形状、纳米形貌及粗糙度数据。凭借采集超过1600万个具有亚纳米高度分辨率的数据点，Phemet已在测量速度与分辨率方面成为行业前列的量测产品。

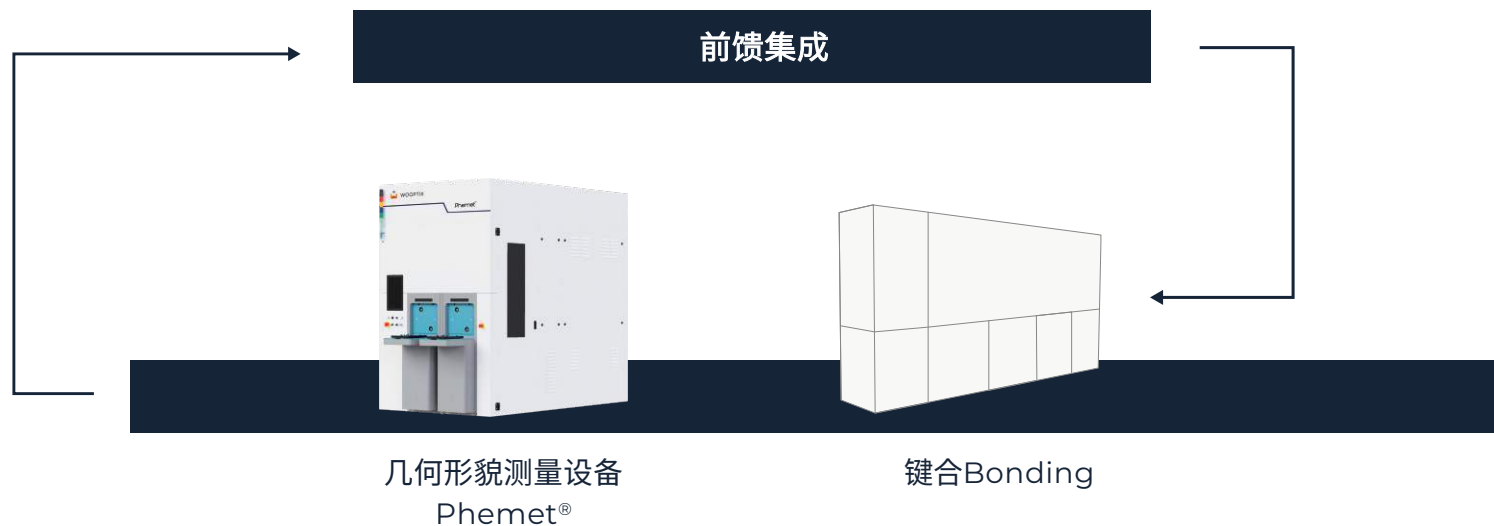
Wooptix为先进晶圆级封装提供晶圆检测与计量系统，可为芯片制造商提供关键数据，通过在其日益复杂的制造工艺中实现全面可追溯性，从而提升良率。

Phemet为300 mm晶圆的在线计量提供自动化解决方案，具备高吞吐量与紧凑安装尺寸的特点，是晶圆厂商的理想选择。该系统支持将其采集的数据应用于前馈算法或其他定制化控制方法中。

优势

- 抗振动性能优异
- 紧凑且灵活的系统设计，在实现高吞吐量的同时，极大限度优化占地面积
- 对XYZ坐标系中的晶圆定位具有高度容差，从而支持大规模生产

前馈集成



Wooptix的计量系统为过程控制带来新的变革

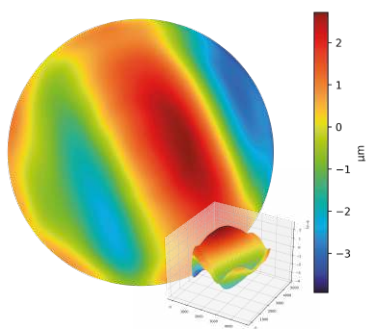
由于工艺微缩化、新型集成技术以及将多种组件集成至统一封装体等趋势，对更高精度过程控制的需求日益增强。

Wooptix系统助力企业快速识别、应对并追踪偏差，从而强化质量控制，提升设备性能。

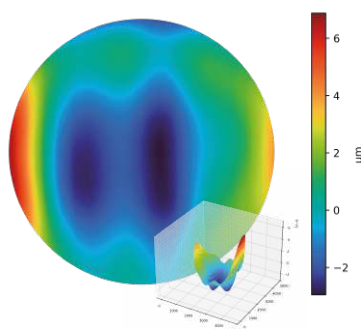
测量结果

Phemet为每项测量提供完整的数据集。

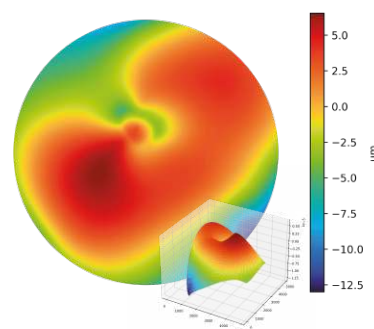
无图形晶圆



有图形晶圆



键合晶圆



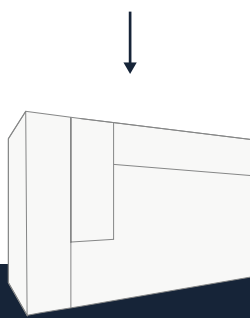
特性

- 晶圆整体几何形状测量
- 垂直放置的晶圆（正面/背面测量）
- 自由形晶圆翘曲 (FFWW)
- +1600万个数据点，亚纳米级分辨率
- 全自动化运行
- 提供符合客户需求的形状数据及其他参数

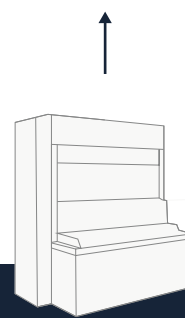
形状畸变测量



形状计量学
Phemet®



光刻



套刻计量



WOOPTIX

公司总部

Tenerife

Nanotec Building
Calle Rectora María Luisa Tejedor Salguero
Las Mantecas Urban Park, 38320
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, Spain
info@wooptix.com +34 822 900 502
www.wooptix.com

办公室

Madrid

Ronda de Poniente 8, Planta 1
Tres Cantos, Madrid. Spain

San Francisco

Palo Alto, CA 94301
United States

Grenoble

MINATEC Enterprises, BHT2
France

| 中国地区



北京量感科技有限公司

info@q-opto.com

010-5365 5786

13522713167 (微信同号)

www.q-opto.com



Wooptix是一家半导体晶圆计量领域的创新企业，能提供快速、精确且具有极高横向分辨率的在线测量方案。凭借其采用源自自适应光学研究的专有技术——波前相位成像（WFPI），该公司的系统可在单次测量中全面测定硅晶圆的整体形状、纳米形貌及表面粗糙度。该公司已积极在亚洲、欧洲和北美地区的多个客户现场推广其解决方案

结合其优异的抗振动性能及易于适应用户需求的特点，这些系统成为单次测量即可完成晶圆形状与纳米形貌分析的理想选择。